

Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Штерн Юрий Исаакович
2	Дата рождения (полная)	19 июня 1952
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Д.т.н., 05.27.06
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Доцент
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1. https://www.miet.ru/ Электронная почта: netadm@miec.ru.
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
	Тип организации	Федеральное государственное автономное учреждение
	Наименование подразделения	Институт перспективных материалов и технологий
	Должность	Профессор
7	Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS):	
	<p>1. Shtern M., Rogachev M., Shtern Y., Gromov D., Kozlov A., Karavaev I. Thin-film contact systems for thermocouples operating in a wide temperature range // Journal of Alloys and Compounds. – 2021. – Vol. 852. – P. 156889-1–156889-10.</p> <p>2. Shtern M., Rogachev M., Shtern Y., Sherchenkov A., Babich A., Korchagin E., Nikulin D. Thermoelectric properties of efficient thermoelectric materials on the basis of bismuth and antimony chalcogenides for multisection thermoelements // Journal of Alloys and Compounds. – 2021. – Vol. 877. – P. 160328-1–160328-13.</p> <p>3. Shtern M.Yu., Karavaev I.S., Shtern Y.I., Kozlov A.O., Rogachev M.S. The Surface Preparation of Thermoelectric Materials for Deposition of Thin-Film Contact Systems // Semiconductors. – 2019. – V. 53, №13. – P.1848-1852.</p> <p>4. Штерн М.Ю., Караваев И.С., Рогачев М.С., Штерн Ю.И., Мустафоев Б.Р., Корчагин Е.П., Козлов А.О. Методики исследования электрического контактного сопротивления в структуре металлическая пленка-полупроводник // Физика и техника полупроводников. – 2022. – Т. 1. – С. 31-37.</p> <p>5. Штерн М.Ю., Козлов А.О., Штерн Ю.И., Рогачев М.С., Корчагин Е.П., Мустафоев Б.Р., Дедкова А.А. Получение и исследование омических контактов с высокой адгезией к термоэлементам // Физика и техника полупроводников. – 2021. – Т. 12. – С. 1097-1104.</p> <p>6. Shtern M.Yu., Sherchenkov A.A., Shtern Yu.I., Rogachev M.S., Babich A.V. Thermoelectric Properties and Thermal Stability of Nanostructured Thermoelectric Materials on the Basis of PbTe, GeTe, and SiGe // Nanobiotechnology Reports. – 2021. – Vol. 16, №3. – P. 363-372.</p>	

	7. Rogachev M.S., Shtern M.Yu., Shtern Yu.I. Mechanisms of Heat Transfer in Thermoelectric Materials // Nanobiotechnology Reports. – 2021. – Vol. 16, №3. – P. 308-315.
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты